Pedidos para Utilizar os equipamentos

Para Utilizar o XPS, fazer contato com:

Prof. Hugo Alvarenga Oliveira.

TEL:2629-5598

Email: hugoao@id.uff.br

Para Utilizar o Raman, fazer contato com:

Prof. Dante Ferreira Franceschini Filho

Sala: A3-17 (Prédio de Física)

Tel: 2629-5782

Email: dante@if.uff.br

Para Utilizar o Analisador de Tensões, fazer contato com:

Profa. Maria da Penha Cindra Fonseca

Tel: 2629-5419

Email: mcindra@vm.uff.br

Para Utilizar os microscópios,

Antes de submeter um projeto de utilização, ou fazer contato com um usuário sênior, deve-se verificar as características e condições das amostras:

Para análises de MEV:

1. Qual é o tamanho das amostras? Existe limitação de tamanho das amostras devido as dimensões da câmara.

2. A amostra é condutora ou isolante? Se a amostra for isolante, há necessidade de metalizá-la previamente.

3. A amostra libera gases ou vapores? Se este for o caso, não poderá ser analisada com o MEV.

4. A amostra é passível de dano ou modificação se submetida a alto vácuo? Se este for o caso, não poderá ser analisada.

5. Se a amostra libera facilmente material pulverulento não é poderá ser análisada.

6. Qual o aumento pretendido? Se for inferior a 5 mil vezes, sugerimos a utilização de um MEV com fonte de elétrons a filamento.

Amostras para análise em MEV têm que ser:

- Limpas
- Secas
- Condutoras

Para amostras de MET:

- A sua amostra tem que ter espessura inferior a 100 nm, para permitir a passagem do feixe de elétrons.
- A amostra tem que ser estável quando submetida ao feixe de elétrons com energia de 200 keV, em condições de ultra alto vácuo.
- As dimensões das amostras devem ser compatíveis com o suporte de amostras do MET (i.e. diâmetro < 3 mm)
- Idealmente, a microestrutura da amostra não deve ser afetada no processo de preparação das amostras.

Para usar os microscópios, click no link

submeter um projeto

Os critérios de seleção das propostas de pesquisa são os seguintes:

- **Coerência e relevância do projeto de pesquisa;**
- **Compatibilidade entre a proposta de pesquisa e as características do equipamento proposto, devendo-se dar prioridade aos projetos que demandarem o desempenho específico proporcionado por cada equipamento;**
- **Efetivo enquadramento da proposta no campo das nanociências ou nanotecnologia;**
- **Produtividade do proponente.**